





Рис. 5. Микроструктура участка фольги в отраженных электронах (a), распределение кремния вдоль линии сканирования $L-L^1(\delta)$, спектр рентгеновского излучения и состав в темном участке (s)

Fig. 5. Microstructure of an area of the foil in reflected electrons (a), silicon distribution along the scanning line $L - L^{\rm I}(b)$, X-ray spectrum and composition in the dark area (c)